



Microelectronic failure analysis [desk reference.

ASM International,
c2002

Monografía

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:38443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhemF0ei5yZW4vMTcxMTQzMtA>

Título: Microelectronic failure analysis [Recurso electrónico] desk reference. 2002 supplement prepared under the direction of the Electronic Device Failure Analysis Society publications committee

Editorial: Materials Park, OH ASM International c2002

Descripción física: vi, 210 p. ill

Mención de serie: E-Libro

Bibliografía: Incluye referencias bibliográficas e índice

Detalles del sistema: Modo de acceso: Worl Wide Web

Fuente de adquisición directa: E-Libro

ISBN: 0871707691 9780871707697

Materia: Electronic apparatus and appliances- Testing- Handbooks, manuals, etc Electronics- Materials- Testing- Handbooks, manuals, etc Microelectronics- Materials- Defects- Handbooks, manuals, etc Microelectronics- Materials- Testing- Handbooks, manuals, etc Semiconductors- Defects- Handbooks, manuals, etc

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es